

基盤産業支援セミナー

「結晶の分析・評価」

～シンクロtron光によって見えるもの～

開催のご案内

主催:愛知県

共催:(公財)科学技術交流財団、愛知工研協会

「知の拠点あいち」のあいちシンクロtron光センターは、分子や原子レベルで物質の組成等を解析できる、次世代のモノづくりに不可欠なナノレベルの先端計測分析施設であり、県内外の様々な産業分野における企業、大学及び公的試験研究機関の方々に御利用いただいています。

この度、シンクロtron光を活用した分析の中でX線回折に焦点をあてた講演会を開催します。

X線回折は結晶の成分の同定や定量、サイズ、構造等を分析・評価する際の最も有力な分析手法の一つです。実験室に設置可能な装置によっても測定できる分析手法ですが、シンクロtron光を利用して測定することのメリットやシンクロtron光に適した測定方法など、事例を交えて御紹介します。本講演会を機会にあいちシンクロtron光センターの活用を御検討いただければ幸いです。

多くの皆様の御参加をお待ちしています。

【日 時】平成29年12月5日(火) 13:30 ~ 16:30

【場 所】ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 9階 906会議室

名古屋市中村区名駅4-4-38 TEL: 052-571-6131(代表)

※名古屋駅より徒歩5分

【プログラム】

時間	内容
13:15 ~13:30	受付
13:30 ~13:35	開会挨拶
13:35 ~14:55 (80分)	「量子ビームを用いた材料構造解析」 株式会社日産アーク デバイス解析部デバイス解析室 室長 伊藤 孝憲 氏 (概要) 放射光、中性子等の量子ビームを用いた材料の構造解析について紹介します。近年、量子ビームの利用は以前より身近になってきました。しかし、量子ビームで得られたデータの解析についてはまだまだ課題があります。データを解析し、定量的な議論の重要性について説明します。
14:55 ~15:10 (15分)	休憩
15:10 ~16:30 (80分)	「放射光 X線トポグラフィーによる半導体結晶の欠陥評価」 名古屋大学 講師 原田 俊太 氏 (概要) トポグラフィーとは、結晶内の欠陥や歪み等の分布や形などを2次元画像として観察する手法で、透過型電子顕微鏡と共に結晶欠陥観察手法として長年使用されています。シンクロtron光を活用したX線トポグラフィーで何がわかるか、どう役立つかについて紹介します。

- 申込方法 下記の申込書に御記入の上、FAX、
郵送または電子メールでお送りください。
- 申込期限 平成29年12月1日（金）（必着）
- 参加費 無料
- 定員 30名（先着順）
- 交通のご案内



- (JR・地下鉄・名鉄・近鉄) 名古屋駅より
- ◎JR 名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
- ◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分
- ※名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを經由 徒歩8分

■ 申込先及び問合せ先

あいち産業科学技術総合センター

共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室 柴田、中川

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

TEL: 0561-76-8315

FAX: 0561-76-8317

メール: BL-riyou@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL: <http://www.aichi-inst.jp/>

基盤産業支援セミナー

「結晶の分析・評価」

～シンクロトロン光によって見えるもの～

参加申込書

平成29年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室 宛

FAX: 0561-76-8317 メール: BL-riyou@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL
	FAX
	メール

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡以外には使用しません。

※受講票は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。